

## メモリ FeRAM

# 128K (16 K×8) ビット SPI

# MB85RS128TY(AEC-Q100 準拠)

#### ■ 概 要

MB85RS128TY は,不揮発性メモリセルを形成する強誘電体プロセスとシリコンゲート CMOS プロセスを用いた 16,384 ワード ×8 ビット構成の FeRAM (Ferroelectric Random Access Memory: 強誘電体ランダムアクセスメモリ ) です。 MB85RS128TY は,自動車などの高温環境下での動作が必要となる用途に適しています。

MB85RS128TYは、シリアルペリフェラルインタフェース(SPI)を採用しています。

MB85RS128TY は, SRAM のようにデータバックアップ用バッテリを使用することなくデータ保持が可能です。

MB85RS128TY に採用しているメモリセルは  $10^{13}$  回の書込み / 読出し動作が可能で, フラッシュメモリや  $E^2PROM$  の書換え可能回数を大きく上回ります。

MB85RS128TY はフラッシュメモリや E<sup>2</sup>PROM のような長い書込み時間は必要とせず, 書込みの待ち時間はゼロです。 したがって, 書込み完了待ちのシーケンスを必要としません。

#### ■特 長

・ビット構成 :16.384 ワード×8 ビット

・ シリアルペリフェラルインタフェース:SPI (Serial Peripheral Interface)

SPI モード 0 (0,0) とモード 3 (1,1) に対応

動作周波数 : 40MHz (Max)
 書込み / 読出し耐性 : 10<sup>13</sup> 回 / バイト

・データ保持特性 :40.2 年 ( + 85 °C),

10.9年(+105℃),

3.38年(+125℃),+125℃条件下での3.38年以上について継続評価中。

・動作電源電圧 :1.8  $V \sim 3.6 V$ 

・ 低消費電力 : 動作電源電流 2.5 mA (Max@40 MHz)

スタンバイ電流 45μA (Max) スリープ電流 12μA (Max)

動作周囲温度 :- 40 °C ~+ 125 °C

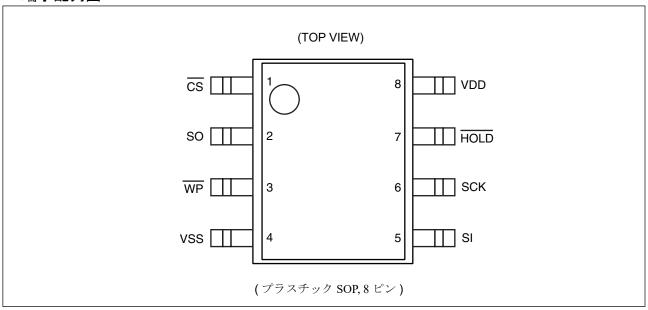
・パッケージ:プラスチック SOP, 8 ピン

AEC-Q100 グレード 1 準拠

本製品は RoHS 指令に適合しています。

富士通セミコンダクターメモリソリューション株式会社はRAMXEED株式会社に社名変更しました。 RAMXEED株式会社は既存の富士通の製品型格のまま引き続き製品提供しサポートしていきます。

#### ■ 端子配列図

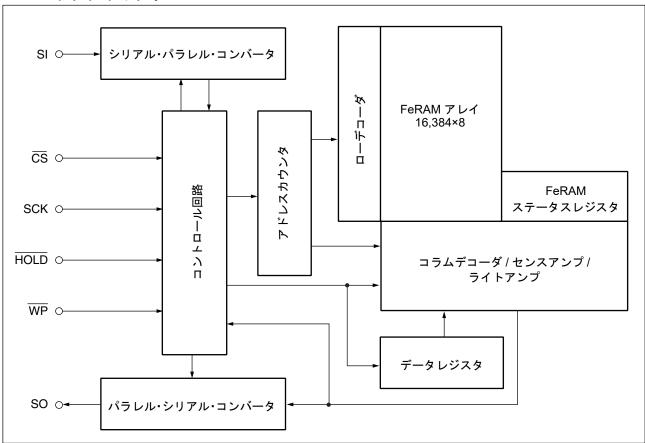


#### ■ 端子機能説明

2

端子番号	端子名	機能説明
1	CS	チップセレクト端子 チップを選択状態にするための入力端子です。 $\overline{CS}$ が "H" レベルのとき,チップは非選択(スタンバイ)状態となり, $SO$ は High- $Z$ になります。このとき,他の端子の入力は無視されます。 $\overline{CS}$ が"L" レベルのとき,チップは選択(アクティブ)状態となります。オペコード入力前に $\overline{CS}$ を立ち下げる必要があります。本端子は,内部で $VDD$ 端子にプルアップされています。
3	WP	ライトプロテクト端子 ステータスレジスタへの書込みを制御する端子です。WPとWPEN(「■ステータスレジスタ」参照)とが関連して,ステータスレジスタの書込みをプロテクトします。詳細な説明は,「■書込みプロテクト」を参照してください。
7	HOLD	ホールド端子 チップを非選択状態にせずにシリアル入出力を休止するときに使用します。HOLD が "L" レベルのとき,ホールド動作となり,SO は High-Z に,SCK,SI は don't care になります。詳細な説明は「■ ホールド動作」を参照してください。
6	SCK	シリアルクロック端子 シリアルデータの入出力のためのクロック入力端子です。SI は SCK の立上りエッジに同期して取り込まれ,SO は SCK の立下りエッジに同期して出力されます。
5	SI	シリアルデータ入力端子 シリアルデータの入力端子です。オペコード,アドレス,書込みデータを入力します。
2	SO	シリアルデータ出力端子 シリアルデータの出力端子です。FeRAM メモリセルアレイの読出しデータ,ステータスレジ スタのデータが出力されます。スタンバイ時は High-Z です。
8	VDD	電源電圧端子
4	VSS	グランド端子

#### ■ ブロックダイヤグラム



#### ■ SPI モード

MB85RS128TY は SPI モード 0 (CPOL = 0, CPHA = 0) と SPI モード 3 (CPOL = 1, CPHA = 1) に対応します。

SCK

SCK

SI

7
6
5
4
3
2
1
0
LSB

SCK

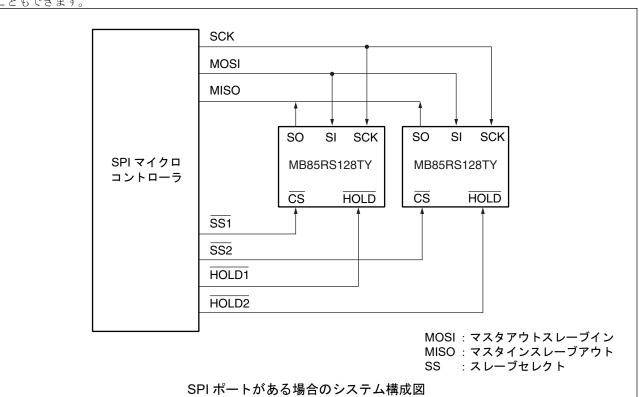
SI

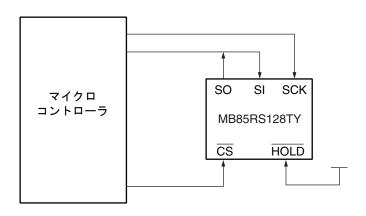
7
6
5
4
3
2
1
0
LSB

SPI モード 3

#### ■ シリアルペリフェラルインタフェース (SPI)

MB85RS128TY は SPI のスレーブとして動作します。SPI ポートを備えたマイクロコントローラを用いて複数のチップを 接続することができます。また, SPI ポートを備えていないマイクロコントローラでは SI と SO をバス接続して使用する こともできます。





SPI ポートがない場合のシステム構成図

#### ■ ステータスレジスタ

ビット番号	ビット名	説明
7	WPEN	ステータスレジスタライトプロテクト 不揮発性メモリ (FeRAM) からなるビットです。WPEN は WP 入力と関連し てステータスレジスタの書込みをプロテクトします (「■ 書込みプロテクト」 を参照)。WRSR コマンドによる書込み, RDSR コマンドによる読出しが可 能です。
6 ∼ 4		未使用 不揮発性メモリからなるビットで WRSR コマンドによる書込みが可能です。 これらのビットは使用しませんが RDSR コマンドで読み出されます。
3	BP1	ブロックプロテクト 不揮発性メモリからなるビットです。WRITE コマンドにおける書込みプロ
2	BP0	テクトのブロックサイズを定義します(「■ブロックプロテクト」を参照)。 WRSR コマンドによる書込み, RDSR コマンドによる読出しが可能です。
1	WEL	ライトイネーブルラッチ FeRAM アレイおよびステータスレジスタが書込み可能であることを示します。WREN コマンドでセット,WRDI コマンドでリセットします。RDSR コマンドで読出しが可能ですがWRSR コマンドで書き込むことはできません。WEL は以下の動作の後リセットされます。電源立上げ後WRDI コマンド認識後SLEEP モードからの復帰後本製品は連続書込みモードに対応しており、以下の動作後もWEL はリセットされず、連続して書込みコマンドを実行することができます。WRSR コマンドWRITE コマンド
0	0	"0" 固定です。

#### ■ オペコード

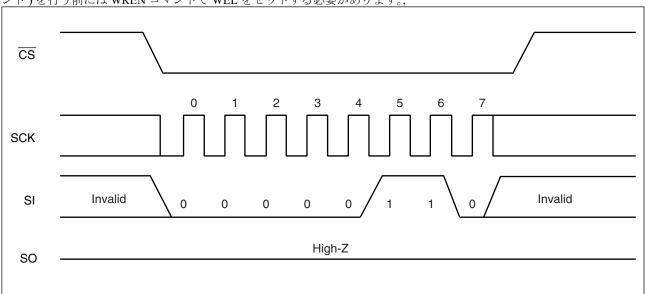
MB85RS128TY はオペコードで指定される 8 種のコマンドを受け付けます。オペコードは下表に示す 8 ビットからなるコードです。これ以外の無効なコードは入力しないでください。オペコード入力中に $\overline{CS}$ を立ち上げるとコマンドは実行されません。

コード名	機能	オペコード
WREN	セットライトイネーブルラッチ	0000 0110в
WRDI	リセットライトイネーブルラッチ	0000 0100в
RDSR	リードステータスレジスタ	0000 0101в
WRSR	ライトステータスレジスタ	0000 0001в
READ	リードメモリコード	0000 0011в
WRITE	ライトメモリコード	0000 0010в
RDID	リードデバイス ID	1001 1111в
SLEEP	スリープモード	1011 1001в

#### ■ コマンド

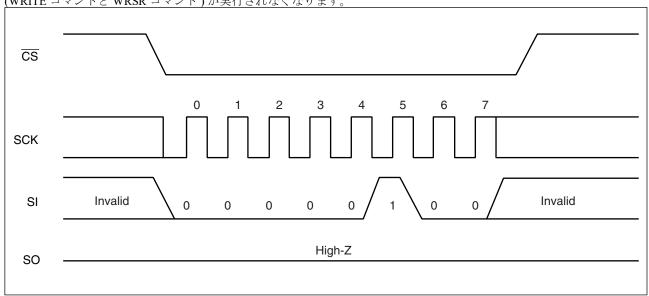
WREN

WREN コマンドは WEL (ライトイネーブルラッチ)を"1"にセットします。書込み動作 (WRSR コマンドと WRITE コマンド)を行う前には WREN コマンドで WEL をセットする必要があります。,



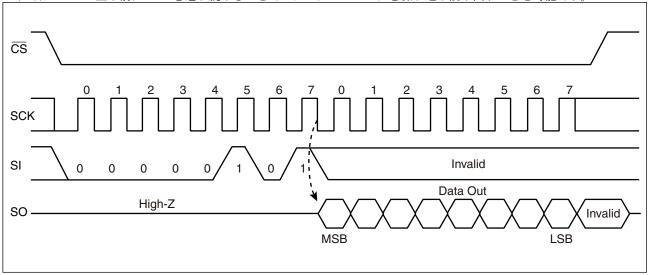
#### • WRDI

WRDI コマンドは WEL (ライトイネーブルラッチ)を "0" にリセットします。WEL がリセットされると書込み動作 (WRITE コマンドと WRSR コマンド)が実行されなくなります。



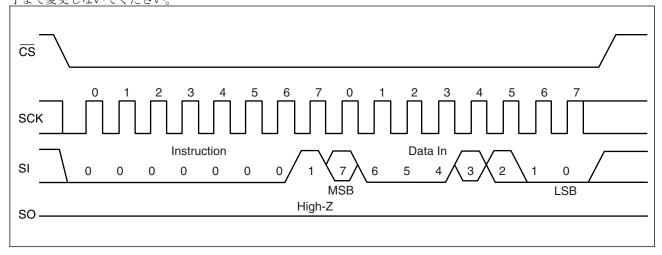
#### · RDSR

RDSR コマンドはステータスレジスタのデータを読み出します。SI に RDSR のオペコードを入力後, SCK に 8 サイクルのクロックを入力します。このとき, SI の値は無効です。SO は SCK の立下りエッジに同期して出力されます。RDSR コマンドでは  $\overline{\text{CS}}$  の立上げ前に SCK を送り続けることでステータスレジスタを繰り返し読み出すことも可能です。



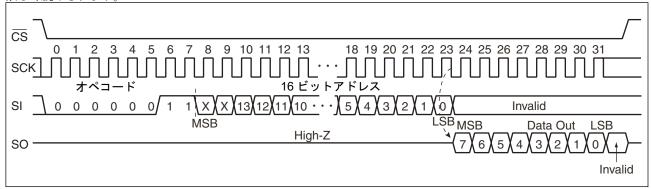
#### WRSR

WRSR コマンドはステータスレジスタの不揮発性メモリビットにデータを書き込みます。SI端子にWRSR のオペコードの後,8ビットの書込みデータを入力します。WEL(ライトイネーブルラッチ)はWRSR コマンドでは書込みできません。ビット 1 に対応する SI の値は無視されます。ステータスレジスタのビット 0 は"0" 固定であり書込みできません。ビット 0 に対応する SI の値は無視されます。 $\overline{WP}$ 端子は,WRSR コマンドの発行前までに必ず値を確定し,コマンドシーケンス終了まで変更しないでください。



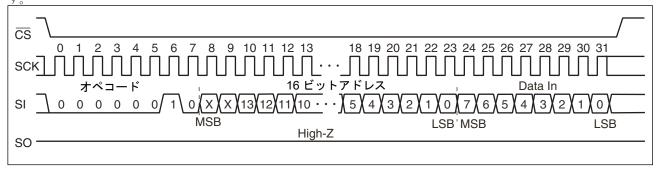
#### READ

READ コマンドは FeRAM メモリセルアレイのデータを読み出します。SI に READ のオペコードと任意の 16 ビットのアドレスを入力します。アドレスの最上位 2 ビットは無効です。その後,SCK に 8 サイクルのクロックを入力します。SO は SCK の立下りエッジに同期して出力されます。この読出し中,SI の値は無効です。 $\overline{CS}$  を立ち上げると READ コマンドは終了しますが, $\overline{CS}$  立上げ前に引き続き SCK に 8 サイクルずつクロックを送り続けることで,アドレスを自動インクリメントして読出しを続けることが可能です。最上位アドレスに達するとロールオーバして 0 番地に戻り,読出しサイクルは際限なく続けられます。



#### WRITE

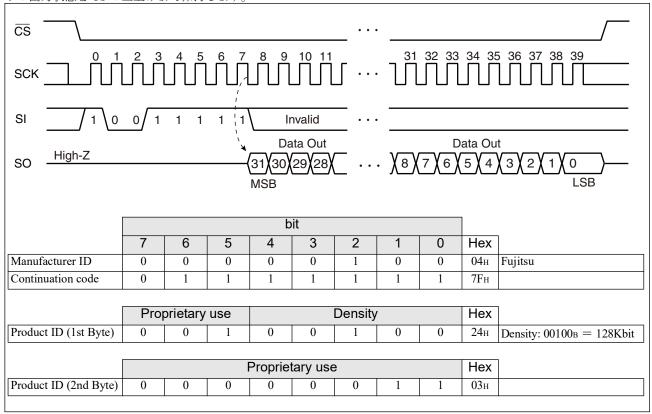
WRITE コマンドは FeRAM メモリセルアレイにデータを書き込みます。SI に WRITE のオペコードと任意の 16 ビットのアドレスおよび 8 ビットの書込みデータを入力します。アドレスの最上位 2 ビットは無効です。8 ビットの書込みデータを入力した時点で FeRAM メモリセルアレイにデータを書き込みます。 $\overline{CS}$  を立ち上げると WRITE コマンドは終了しますが, $\overline{CS}$  立上げ前に引き続き書込みデータを 8 ビットずつ送り続けることで,アドレスを自動インクリメントして書込みを続けることが可能です。最上位アドレスに達するとロールオーバして 0 番地に戻り,書込みサイクルは際限なく続けられます。



#### · RDID

RDID コマンドは,固定のデバイス ID を読み出します。SI 端子に RDID のオペコードを入力後,SCK に 32 サイクルのクロックを入力します。このとき,SIの値は無効です。SOはSCKの立下りエッジに同期して出力されます。出力はManufacturer ID (8bit) / Continuation code (8bit) / Product ID (1st Byte) / Product ID (2nd Byte) の順に出力されます。

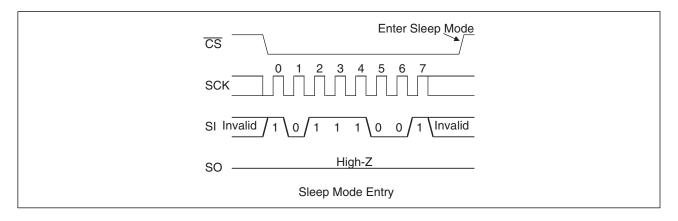
RDID コマンドでは、SCK にクロックを送り続けることで 32 ビットのデバイス ID を出力します。出力後、SO は最終ビットの出力状態を  $\overline{\text{CS}}$  の立上げまで保持します。



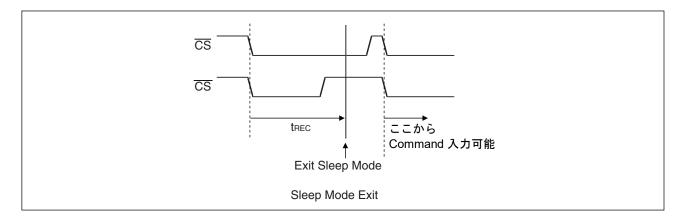
#### SLEEP

SLEEP コマンドは,LSI をスリープモードと呼ばれる低消費電力モードに移行します。スリープモードへの移行は,SLEEP コマンドのオペコード入力後の  $\overline{\text{CS}}$  立上りエッジにて行われます。しかし,SLEEP コマンドのオペコード入力後の  $\overline{\text{CS}}$  立上げ前に,SCK を 1CLK でも入力した場合,SLEEP コマンドはキャンセルされます。

スリープモードに移行すると、SCK 端子および SI 端子への入力は論理的に無効となり、SO は High-Z となります。CS 以外の入力端子を VSS または VDD に固定しない場合、貫通電流が流れる可能性があります。



スリープモードから通常動作への復帰は,  $\overline{\text{CS}}$  の立下げから trec (max 400  $\mu$ s) 経過後に行われます (下図参照)。 trec 経過前に  $\overline{\text{CS}}$  を "H" に戻すことは可能ですが,"H" に戻した  $\overline{\text{CS}}$  を trec 経過前に再度立ち下げることは禁止です。



#### ■ ブロックプロテクト

ステータスレジスタの BP1, BP0 の値により WRITE コマンドでの書込みプロテクトブロックを設定できます。

BP1	BP0	プロテクトブロック
0	0	なし
0	1	3000н~3FFFн ( 上位 1/4)
1	0	2000н~3FFFн(上位 1/2)
1	1	0000н ~ 3FFFн ( すべて )

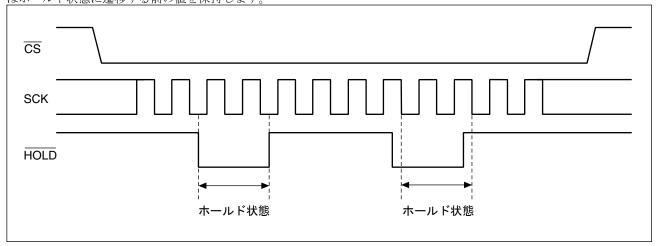
#### ■ 書込みプロテクト

WEL, WPEN,  $\overline{\text{WP}}$  の値により WRITE コマンドおよび WRSR コマンドの書込み動作がプロテクトされます。

WEL	WPEN	WP	プロテクトブロック	アンプロテクトブロック	ステータスレジスタ
0	X	X	プロテクト	プロテクト	プロテクト
1	0	X	プロテクト	アンプロテクト	アンプロテクト
1	1	0	プロテクト	アンプロテクト	プロテクト
1	1	1	プロテクト	アンプロテクト	アンプロテクト

#### ■ ホールド動作

 $\overline{\text{CS}}$ を"L"レベルに保ったまま $\overline{\text{HOLD}}$ を"L"レベルにすると、コマンドが中止されることなくホールド状態に保たれます。ホールド状態の始まりと終わりのタイミングは、下図に示すように $\overline{\text{HOLD}}$ 端子入力がホールド状態に遷移したとき、SCKが"H"レベルか"L"レベルかで異なります。SCKが"L"レベルの時に $\overline{\text{HOLD}}$ 端子を"L"レベルにした場合は、SCKが"L"レベルの時に $\overline{\text{HOLD}}$ 端子を"L"レベルにした場合は、SCKが"L"レベルの時に $\overline{\text{HOLD}}$ 端子を"L"レベルにした場合は、SCKが"H"レベルの時に $\overline{\text{HOLD}}$ 端子を"L"レベルに戻してください。市場では、SCKが"H"レベルの時に $\overline{\text{HOLD}}$ 端子を"L"レベルにた場合は、SCKが"H"レベルの時に $\overline{\text{HOLD}}$ 端子を"H"レベルに戻してください。ホールド状態では任意のコマンドの動作は中断され、SCK、SI入力は don't care となります。また読出しコマンド (RDSR、READ)において SOが High-Z になります。ホールド状態において  $\overline{\text{CS}}$ を立ち上げると、コマンド処理を終了します。ただし、コマンド認識前に終了した場合、WELはホールド状態に遷移する前の値を保持します。



#### ■ 絶対最大定格

14日	<b>€</b> 7 □	定村	出仕	
項目	記号	最小	最大	単位
電源電圧*	V <sub>DD</sub>	- 0.5	+ 4.0	V
入力電圧*	Vin	- 0.5	$V_{DD} + 0.5 (\le 4.0)$	V
出力電圧*	Vout	- 0.5	$V_{DD} + 0.5 (\le 4.0)$	V
動作周囲温度	TA	- 40	+ 125	°C
保存温度	Tstg	- 55	+ 150	°C

<sup>\*:</sup> Vss = 0 V を基準にした値です。

<注意事項> 絶対最大定格を超えるストレス (電圧,電流,温度など) の印加は、半導体デバイスを破壊する可能性があります。したがって、定格を一項目でも超えることのないようご注意ください。

#### ■ 推奨動作条件

項目	記号		単位		
	记与	最小	標準	最大	中世
電源電圧*1	V <sub>DD</sub>	1.8	3.3	3.6	V
動作周囲温度*2	TA	- 40	_	+ 125	°C

<sup>\*1:</sup> Vss = 0 V を基準にした値です。

<注意事項> 推奨動作条件は,半導体デバイスの正常な動作を確保するための条件です。電気的特性の規格値は,すべて この条件の範囲内で保証されます。常に推奨動作条件下で使用してください。この条件を超えて使用すると ,信頼性に悪影響を及ぼすことがあります。

データシートに記載されていない項目,使用条件,論理の組合せでの使用は,保証していません。記載されている以外の条件での使用をお考えの場合は,必ず事前に営業部門までご相談ください。

<sup>\*2:</sup>本デバイスだけが動作している場合の動作周囲温度です。パッケージ表面の温度とほぼ同じと考えてください。

#### ■ 電気的特性

#### 1. 直流特性

(推奨動作条件において)

45.0	<del>-</del> 7 -	条件			規格値		# / <del>-</del>
項目	記号			最小	標準	最大	単位
		$0 \le \overline{\mathrm{CS}} < V$	/ <sub>DD</sub>	_	_	200	
		$\overline{GG} = V$	25 °C	_	_	1	
入力リーク電流*1	$ I_{LI} $	$\overline{\mathrm{CS}} = \mathrm{V}_{\mathrm{DD}}$	125 °C	_	_	2	μΑ
		$\overline{\mathrm{WP}}, \overline{\mathrm{HOLD}}, \mathrm{SCK}$	25 °C	_		1	
		$SI = 0 V \sim V_{DD}$	125 °C	_	_	2	
	IT I		25 °C	_		1	
出力リーク電流 *2	Ilo	$SO = 0 V \sim V_{DD}$	125 °C	_		2	μΑ
動作電源電流 *3	Idd	SCK = 40 N	SCK = 40  MHz		2.1	2.5	mA
スタンバイ電流	Isb	$SCK = SI = \overline{WP} = \overline{HOLD}$		_	20	45	μА
スリープ電流	Izz	$\overline{\text{CS}} = \text{V}_{\text{D}}$ 全入力 Vss また		_	6	12	μΑ
"H" レベル入力電圧	VIH	$V_{DD} = 1.8 \text{ V} \sim 3.6$	$V_{DD} = 1.8 \text{ V} \sim 3.6 \text{ V}$		_	$V_{\mathrm{DD}}+0.5$	V
"L" レベル入力電圧	VIL	$V_{DD} = 1.8 \text{ V} \sim 3.6 \text{ V}$		- 0.5	_	$V_{DD} \times 0.2$	V
"H" レベル出力電圧	Voh	$I_{OH} = -2mA$		$V_{\rm DD} - 0.5$	_	_	V
"L" レベル出力電圧	Vol	$I_{OL} = 2m$	$I_{OL} = 2mA$		_	0.4	V
CS端子のプルアップ抵抗	Rp	_		18	33	80	kΩ

\*1:該当端子: $\overline{\text{CS}}$ , $\overline{\text{WP}}$ , $\overline{\text{HOLD}}$ , $\overline{\text{SCK}}$ , $\overline{\text{SI}}$ 

\* 2:該当端子: SO

\* 3:入力端子条件: VDD-0.2V もしくは VSS

#### 2. 交流特性

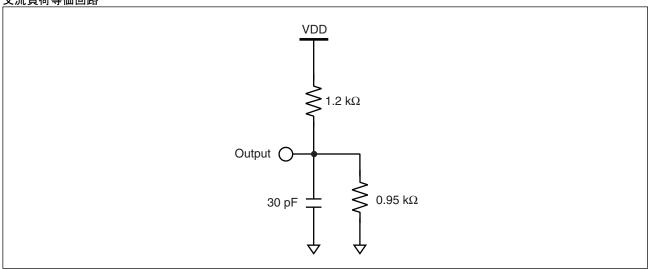
2. 交流特性	記号	規村	 各値	単位	条件
項目	記写	最小	最大	早1型	$V_{ m DD}$
	fск	0	33	MHz	1.8V ~ 2.7V
SCK クロック周波数	ICK	0	40	IVITIZ	2.7V ~ 3.6V
A S A L AUTHUR	torr	13	_		1.8V ~ 2.7V
クロックハイ時間	tсн	11	_	ns	2.7V ~ 3.6V
クロックロー時間	tcl	13	_	no	1.8V ~ 2.7V
グロックロー時间	icl.	11	_	ns	2.7V ~ 3.6V
チップセレクトセットアップ時間	tcsu	10	_	ns	_
チップセレクトホールド時間	tcsh	10	_	ns	_
出力ディセーブル時間	tod	_	16	ns	_
	tony	_	13	- ns	1.8V ~ 2.7V
出力データ確定時間	tody	_	9		2.7V ~ 3.6V
出力ホールド時間	tон	0	_	ns	_
非選択時間	tD	40	_	ns	_
データ立上り時間	tr	_	50	ns	_
データ立下り時間	tF	_	50	ns	_
データセットアップ時間	tsu	5	_	ns	_
データホールド時間	<b>t</b> H	5	_	ns	_
HOLD セットアップ時間	ths	10	_	ns	_
HOLD ホールド時間	tнн	10	_	ns	_
HOLD 出力フローティング時間	tHZ		20	ns	
HOLD 出力アクティブ時間	tlz		20	ns	
SLEEP 復帰時間	trec		400	μs	_

#### 交流特性測定条件

電源電圧  $:1.8 \text{ V} \sim 3.6 \text{ V}$  動作周囲温度  $:-40 \text{ °C} \sim + 125 \text{ °C}$  入力電圧振幅  $:\text{V}_{DD}\times 0.8 \leq \text{V}_{IL} \leq \text{V}_{DD}\times 0.2$ 

入力立上り時間:5 ns入力立下り時間:5 ns入力判定レベル:VDD/2出力判定レベル:VDD/2

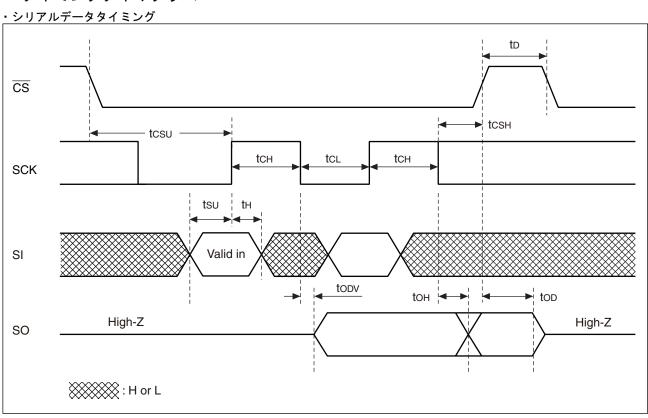
#### 交流負荷等価回路

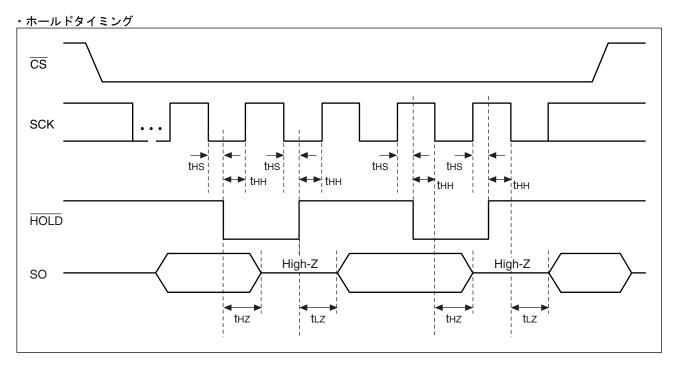


#### 3. 端子容量

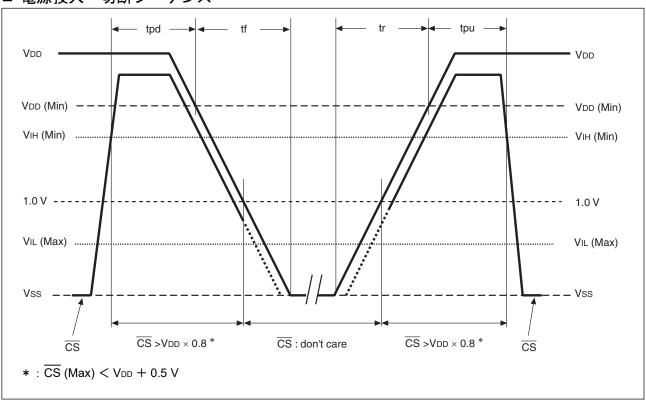
百日	=コ.巳	久卅	規村	単位	
項目	記号	条件	最小	最大	甲位
出力容量	Со	$V_{DD} = 3.3 \text{ V},$	_	8	pF
入力容量	Cı	$V_{IN} = V_{OUT} = 0 V \sim V_{DD},$ $f = 1 \text{ MHz}, T_A = +25 \text{ °C}$	_	6	pF

#### ■ タイミングダイヤグラム





#### ■ 電源投入・切断シーケンス



	<b>₽</b> 7 ₽	規札	 各値	単位	条件
項目	記 <del>号</del>	最小	最大	<b>中</b> 业	V <sub>DD</sub>
電源 OFF 時の CS レベル保持時間	4 m d	400	_		1.8V ~ 2.7V
電源 OFF 時の CS レベル 株特時间	tpd	0	_	ns	2.7V ~ 3.6V
電源 ON 時の CS レベル保持時間	tpu	250	_	μs	_
電源の立上げ時間	tr	0.05	_	ms/V	_
電源の立下げ時間	tf	0.1	_	ms/V	_

規定されたリードサイクル , ライトサイクルまたは電源投入・切断シーケンスを守らない動作が実行された場合 , 記憶 データの保証はできません。

#### ■ FeRAM の特性

75 P	規格値		<b>24</b> /4	/#. #v.	
項目	最小	最大	単位	備考	
書込み / 読出し耐性*1	1013	_	回 / バイト	書込みおよび読出し回数の合計 動作周囲温度 T <sub>A</sub> = + 125 ℃	
	3.38*3			動作周囲温度 TA = + 125 °C	
データ保持特性*2	10.9	_	年	動作周囲温度 TA = + 105 °C	
	40.2			動作周囲温度 TA = + 85 °C	

- \*1: FeRAM は破壊読出しを行っているため,書込みおよび読出し回数の合計が書込み/読出し耐性の最小値です。
- \*2:データ保持特性の最小年数は、出荷直後に初めて読み書きしたデータの保持時間です。
- \*3:+125°C条件下での3.38年以上について継続評価中。 これらの保持時間は,信頼性評価結果からの換算値です。

#### ■ 使用上の注意

リフロー後にデータの書き込みを行ってください。リフロー前のデータは保証できません。

#### ■ ESD・ラッチアップ

試験項目	DUT	規格値
ESD HBM( 人体帯電モデル ) JESD22-A114 準拠	MB85RS128TYPNF-GS-BCE1	+ 2000 V 以上 - 2000 V 以下
ESD CDM(デバイス帯電モデル) JESD22-C101 準拠		+ 1000 V 以上 - 1000 V 以下
ラッチアップ (パルス電流注入法) JESD78 準拠	MB85RS128TYPF-GS-BCERE1	+ 125mA 以上 - 125mA 以下
ラッチアップ (電源過電圧法) JESD78 準拠		5.4V 以上

#### ■ リフロー条件および保管期限

JEDEC 条件, Moisture Sensitivity Level 3 (IPC / JEDEC J-STD-020E)。

#### ■ 含有規制化学物質対応

本製品は、REACH 規則、EU RoHS 指令、中国 RoHS に準拠しております。

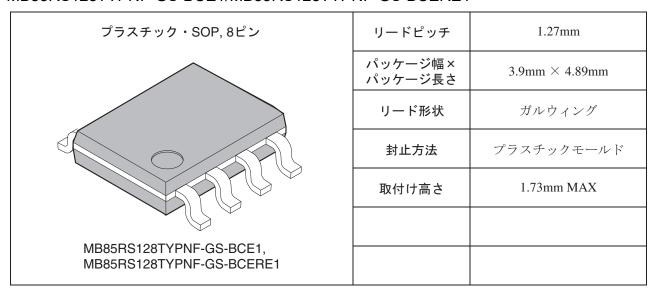
#### ■ オーダ型格

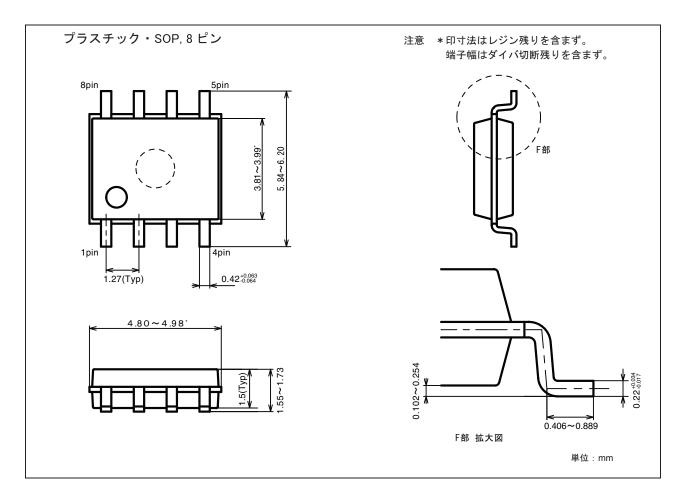
型格	パッケージ	出荷形態	最小出荷単位
MB85RS128TYPNF-GS-BCE1	プラスチック・SOP, 8 ピン	チューブ	*
MB85RS128TYPNF-GS-BCERE1	プラスチック・SOP, 8 ピン	エンボステーピング	1500

<sup>\*</sup>最小出荷単位については、営業部門にご確認ください。

#### ■ パッケージ・外形寸法図

#### MB85RS128TYPNF-GS-BCE1/MB85RS128TYPNF-GS-BCERE1





#### ■ 捺印図 (例)

#### MB85RS128TYPNF-GS-BCE1/MB85RS128TYPNF-GS-BCERE1

[MB85RS128TYPNF-GS-BCE1] [MB85RS128TYPNF-GS-BCERE1]

# S12TY A1907 V01

S12TY:製品名

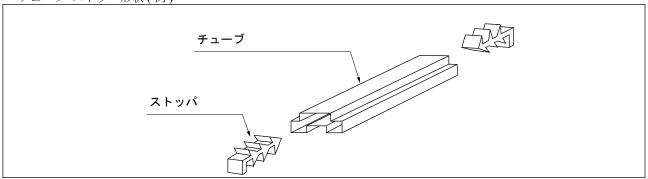
A1907: A(CS コード) + 1907(年週コード)

V01:整理番号

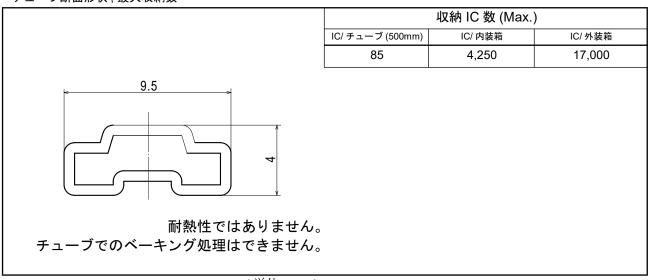
#### ■ 包装

#### MB85RS128TYPNF-GS-BCE1/MB85RS128TYPNF-GS-BCERE1

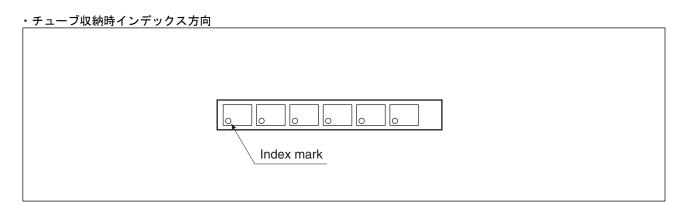
- 1. チューブ (MB85RS128TYPNF-GS-BCE1)
- 1.1 チューブ寸法図
- ・ チューブ・ストッパ形状(例)



#### ・チューブ断面形状, 最大収納数



(単位:mm)



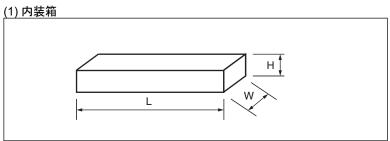
#### 1.2 製品表示ラベル (例)

表示 I: 内装箱/アルミラミネート袋/(エンボステーピングの場合には,リールにも貼付)

製品表示 [C-3 ラベル (50mm×100mm) +補助ラベル (20mm×100mm)]

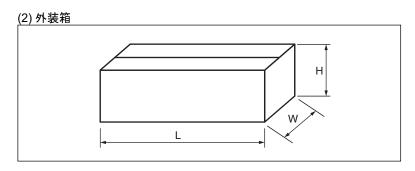


#### 1.3 包装箱外形寸法図



L	W	Н
533	124	73
		( ))////-

(単位:mm)

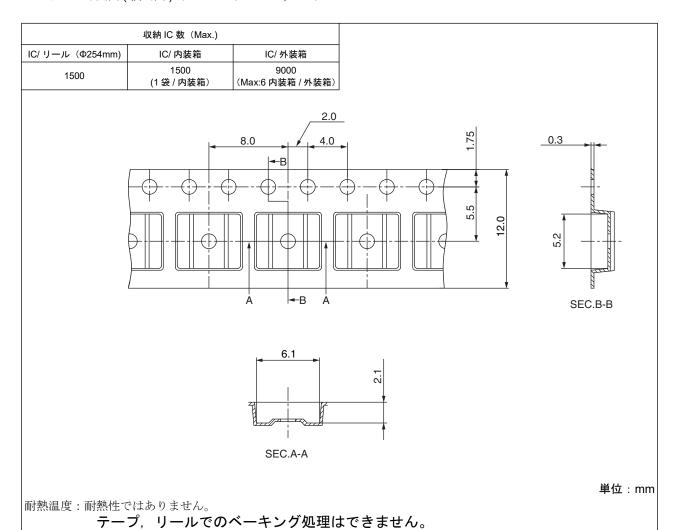


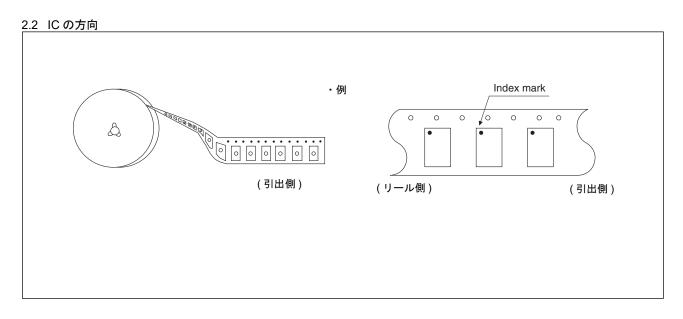
L	W	Н
549	277	180

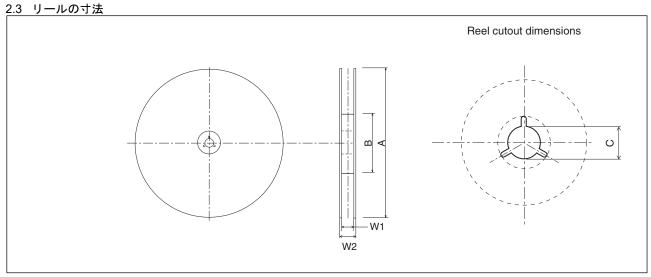
(単位:mm)

#### 2. エンボステープ (MB85RS128TYPNF-GS-BCERE1)

#### 2.1 テープ寸法図 (模式図) (プラスチック SOP,8 ピン)







			単位	: mm
Α	В	С	W1	W2
254	100	13	13.5	17.5

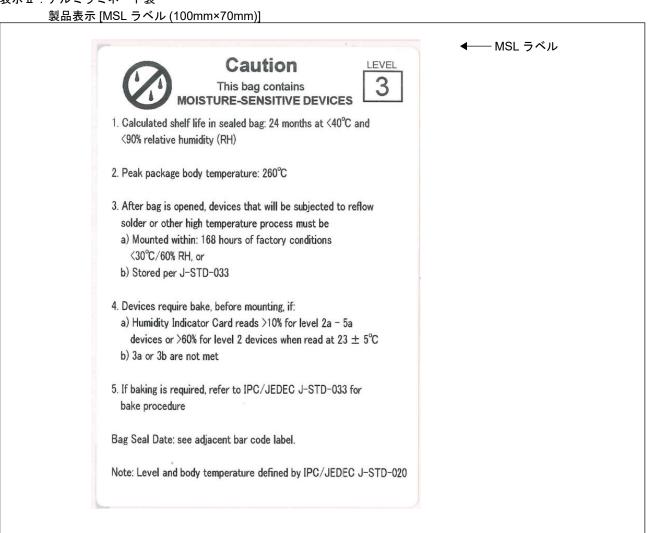
#### 2.4 製品表示ラベル (例)

表示 I: 内装箱/アルミラミネート袋/(エンボステーピングの場合には,リールにも貼付)

製品表示 [C-3 ラベル (50mm×100mm) +補助ラベル (20mm×100mm)]

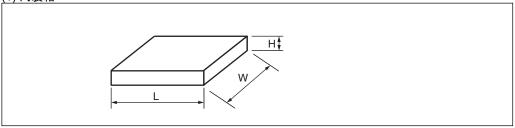


#### 表示 II: アルミラミネート袋



#### 2.5 包装箱外形寸法図

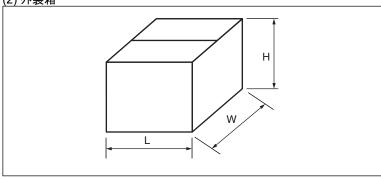
#### (1) 内装箱



テープ幅	L	W	Н
12	265	262	51

(単位:mm)

#### (2) 外装箱



L	W	Н
549	277	180

(単位:mm)

#### ■ 本版での主な変更内容

変更箇所は,本文中のページ左側の によって示しています。

ページ	場所	変更箇所
_	全般	技術用語の変更 FRAM → FeRAM

#### RAMXEED 株式会社

〒 222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目 100 番 45(新横浜中央ビル) https://ramxeed.com/jp/

本資料の記載内容は、予告なしに変更することがありますので、製品のご購入やご使用などのご用命の際は、当社営業窓口にご確認ください。

本資料に記載された動作概要や応用回路例などの情報は、半導体デバイスの標準的な動作や使い方を示したもので、実際に使用する機器での動作を保証するものではありません。したがって、お客様の機器の設計においてこれらを使用する場合は、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因する損害などについては、当社はその責任を負いません。

本資料は、本資料に記載された製品および動作概要・回路図を含む技術情報について、当社もしくは第三者の特許権、著作権等の知的財産権やその他の権利の使用権または実施権を許諾するものではありません。また、これらの使用について、第三者の知的財産権やその他の権利の実施ができることの保証を行うものではありません。したがって、これらの使用に起因する第三者の知的財産権やその他の権利の侵害などについて、当社はその責任を負いません。

本資料に記載された製品は、通常の産業用、一般事務用、パーソナル用、家庭用などの一般的用途に使用されることを意図して設計・製造されています。極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途(原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など)、または極めて高い信頼性が要求される用途(海底中継器、宇宙衛星など)に使用されるよう設計・製造されたものではありません。したがって、これらの用途へのご使用をお考えのお客様は、必ず事前に当社営業窓口までご相談ください。ご相談なく使用されたことにより発生した損害などについては、当社は責任を負いません。

半導体デバイスには、ある確率で故障や誤動作が発生します。本資料に記載の製品を含め当社半導体デバイスをご使用いただく場合は、当社半導体デバイスに故障や誤動作が発生した場合も、結果的に人身事故、火災事故、社会的な損害などを生じさせないよう、お客様の責任において、装置の冗長設計、延焼対策設計、過電流防止対策設計、誤動作防止設計などの安全設計をお願いします。

本資料に記載された製品および技術情報を輸出または非居住者に提供する場合は,外国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関連法規などの規制を ご確認の上,必要な手続きをおとりください。

本資料に記載されている社名および製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。